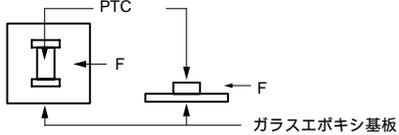
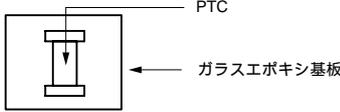
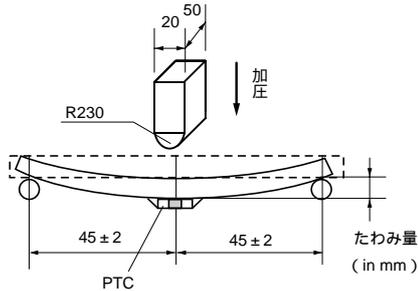
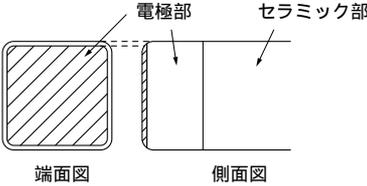


No.	項目	規格	試験方法									
1	抵抗値 (R25)	定格値を満足します。	周囲温度 25 において、最大電圧 3 分印加後、室温 (25) に 2 時間放置したのち 1.5Vdc 以下 (測定電流 10mA 以下) の直流端子電圧を用いて測定します。									
2	端子電極固着力	端子電極の剥離または、その徴候は起きません。	<p>試料を下图のように試験基板にはんだ付けし * 2、矢印 F 方向に 5.0N の力を加えます。(PTC = ポジスタ®)</p> 									
3	耐振性	<p>外観に著しい異常はありません。</p> <p>25 での抵抗値の変化率は、初期値の ± 20% 以内にあります。</p> <p>* 1</p>	<p>試料を下图のように試験基板にはんだ付けし * 2、</p> <p>振動：10 ~ 2000 ~ 10Hz (約 20 分間)</p> <p>最大振幅：3.0mm</p> <p>互いに垂直な 3 方向に 4 時間ずつ (計 12 時間) 行います。</p> <p>試験条件は「MIL-STD-204D」に準拠します。</p> 									
4	耐基板曲げ性	<p>外観に著しい異常はありません。</p> <p>25 での抵抗値の変化率は、初期値の ± 20% 以内にあります。</p> <p>* 1</p>	<p>試料を下图のように試験基板にはんだ付けし * 2、基板裏から下記条件の力を加える。</p> <p>加圧スピード：1.0mm/秒</p> <p>たわみ量：2.0mm，保持時間：5 ± 1 秒</p> <p>基板寸法：100 × 40 × 1.6mm</p> <p>基板材質：ガラスエポキシ基板</p> 									
5	はんだ付け性	<p>端子電極の 95% 以上に切目なくはんだが附着します。</p> <p>25 での抵抗値の変化率は、初期値の ± 20% 以内にあります。</p> <p>* 1</p>	<p>試験条件は「JIS C 5102 8.4 項」に準拠します。</p> <p>はんだ温度：230 ± 5</p> <p>はんだ：H60 または H63</p> <p>浸漬時間：3 ± 0.5 秒</p> <p>浸漬位置：端子電極が隠れるまで</p>									
6	はんだ耐熱性	<p>25 での抵抗値の変化率は、初期値の ± 20% 以内にあります。</p> <p>* 1</p> <p>下图の斜線で示す電極端面部 (素子コーナー部を含まず) に著しい外観異常のないこと。</p> 	<p>はんだ温度：温度：260 ± 5</p> <p>はんだ：H60 または H63</p> <p>フラックス：塩素含有 0.2Wt% 以下</p> <p>浸漬時間：10 ± 0.5 秒</p> <p>浸漬位置：端子電極が隠れるまで</p> <p>予熱：浸漬前に 150 ± 5 で 3 分間行う。</p>									
7	耐熱性		<p>試料を評価用基板にはんだ付けします。* 2</p> <p>温度 150 ± 3 の恒温槽に入れ、1000 ± 12 時間放置します。</p>									
8	耐寒性		<p>試料を評価用基板にはんだ付けします。* 2</p> <p>温度 - 40 ± 3 の恒温槽に入れ、1000 ± 12 時間放置します。</p>									
9	耐湿性	<p>外観に著しい異常はありません。</p> <p>25 での抵抗値の変化率は、初期値の ± 20% 以内にあります。</p> <p>* 1</p>	<p>試料を評価用基板にはんだ付けします。* 2</p> <p>温度 85 ± 3、相対湿度 80 ~ 85% の恒温恒湿槽に入れ、1000 ± 12 時間放置します。</p>									
10	耐熱衝撃性 * 3	<p>< 狭偏差品 ></p> <p>検知温度変化は、初期値の ± 1 以内にあります。</p>	<p>試料を評価用基板にはんだ付けします。* 2</p> <table border="1" data-bbox="938 2000 1321 2078"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温度 ()</th> <th>時間 (分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>- 55 + 0/ - 3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+ 125 + 3/ - 0</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>を 1 サイクルとして 1000 サイクル行います。</p>	段階	温度 ()	時間 (分)	1	- 55 + 0/ - 3	30	2	+ 125 + 3/ - 0	30
段階	温度 ()	時間 (分)										
1	- 55 + 0/ - 3	30										
2	+ 125 + 3/ - 0	30										

前ページより続く

No.	項目	規格	試験方法
11	高温高湿負荷	外観に著しい異常はありません。 25 での抵抗値の変化率は、初期値の $\pm 20\%$ 以内にあります。 * 1	試料を評価用基板にはんだ付けします。* 2 温度 85 ± 3 、相対湿度 $80 \sim 85\%$ の恒温恒湿槽に入れ、最大電圧を 1000 ± 12 時間印加します。
12	高温負荷	< 狭偏差品 > 検知温度変化は、初期値の ± 1 以内にあります。	試料を評価用基板にはんだ付けします。* 2 温度 85 ± 3 の恒温槽に入れ、最大電圧を 1000 ± 12 時間印加します。

* 1 : 抵抗値測定は、1.5V以下の直流電圧で行います。試験後の抵抗値測定は、 25 ± 2 中に2時間放置後行います。

* 2 : 評価時のはんだ付けは、標準ランド寸法のガラスエポキシ基板に、「使用上の注意」に記載の弊社推奨評価はんだを用い推奨のはんだ付け条件により行っています。

* 3 : 耐熱衝撃性の抵抗変化率は、はんだ付け部劣化による接続不具合が原因である場合は保証対象外とします。